

# 新製品ニュース！！

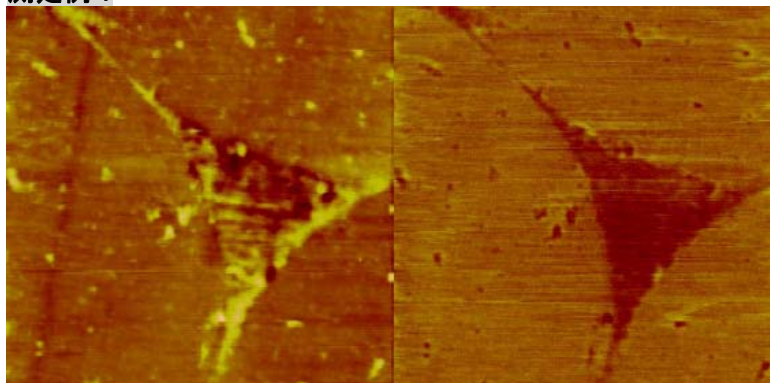
Jul-07

## ナノサーマルアナリシスシステムに 新機能モジュールが加わりました。

新機能 : Scanning Thermal Microscopy Module  
(試料表面温度マップ、熱伝導性像測定)

- 用途例 :
- ◆ 磁気ヘッドの欠陥部発見
  - ◆ ファイバー／エポキシ等のコンポジット熱伝導性像
  - ◆ 電子回路基板内の温度分布
  - ◆ 多層フィルムやブレンドポリマーの識別

### 測定例 1



AFMTポグラフィ

サーマルイメージ

ガラスファイバー/エポキシコンポジット測定  
スキャン幅 : 3ミクロンx3ミクロン

### 測定例 2

磁気記録ヘッドの欠陥部検出  
スキャン幅 : 1.5ミクロンx0.75ミクロン



AFMTポグラフィ

サーマルイメージ

※グリーン円内に 60 ナノメートルの欠陥部が検出されています。

## 仕様

- 測定モード : プローブ先端温度
- 温度分解能 : 0.1°C以下
- プローブ先端径 : 100nm 以下
- プローブ高さ : 10 ミクロン
- カンチレバー長さ: 150 ミクロン
- 共鳴周波数 : ~50KHz

～詳細は下記までお問い合わせ下さい

(株)日本サーマル・コンサルティング

Email : [info@thermconsult.co.jp](mailto:info@thermconsult.co.jp) [www.therm-info.com](http://www.therm-info.com)

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-5-11 新宿三葉ビル 5F      PH03-5339-1470 Fax03-5339-1471  
大阪オフィス 〒542-0081 大阪府中央区船場 1-12-3 船場グランドビル 3F      PH06-4705-5587 Fax06-6260-1113